# **EUROPEAN PATENT OFFICE**

# **Patent Abstracts of Japan**

**PUBLICATION NUMBER** 

62242378

**PUBLICATION DATE** 

22-10-87

APPLICATION DATE APPLICATION NUMBER 14-04-86 61085722

APPLICANT: KOMATSU LTD;

INVENTOR :

YAMAGUCHI TADAYOSHI;

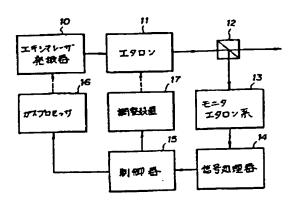
INT.CL.

H01S 3/102 H01S 3/094 H01S 3/105

TITLE

CONTROLLING METHOD FOR

WAVELENGTH OF LASER LIGHT



ABSTRACT :

PURPOSE: To control the wavelength of a laser light beam without using a spectroscope by making part of oscillated laser light beams fall on an optical means of forming interference fringes, and by changing the wavelength of the oscillated laser light beams so that the position of the interference fringes be coincident with a position relevant to a target wavelength.

CONSTITUTION: An excimer laser oscillator 10 oscillates laser light beams having a wavelength of an ultraviolet area, and an etalon, one of wavelength selecting means, allows only laser light beams of specified wavelength to pass through, while a beam splitter 12 splits incident laser light beams, leading one of them to a main use and the other to a monitor etalon system 13. Interference fringes are formed on a detecting plane, and a line image sensor 13c supplies a signal processor 14 with informations on the position and intervals of these interference fringes. The signal processor 14 compares a found wavelength with a target wavelength and delivers a control signal to a controller 15 so as to make the oscillated wavelength coincide with the target wavelength. The controller 15 gives a control to a gas processor 16 or an adjusting unit 17 or to both of them.

COPYRIGHT: (C)1987, JPO& Japio

THIS PAGE BLANK (USPTO)

### 卵日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

#### 昭62 - 242378 ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

磁公開 昭和62年(1987)10月22日 @Int\_CI\_4 識別記号 庁内整理番号 7630-5F 7630-5F H 01 S 3/102 3/094 審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁) 7630-5F

レーザ光の波長制御方法 ❷発明の名称

> 願 昭61-85722 ②特

願 昭61(1986)4月14日 ❷出

特許法第30条第1項適用 昭和60年12月20日 社団法人発明協会発行の発明協会公開技報により発表

平塚市高村203-14-406 康 梶 Щ ⑫発 明 者 驟 平塚市万田18 砂発 明 者 斉 藤 夫 平塚市万田18 砂発 明 板 倉 平塚市万田18 林 理 ⑫発 明 者 若 平塚市万田18 若 雅 彦 砂発 明 者 小 平塚市北金目1214-7 忠 錢 眀 者 Ш 砂発 東京都港区赤坂2丁目3番6号 株式会社小松製作所 切出 願 人 高久 砂代 理 弁理士 木村

ø

#### 1. 発明の名称

レーザ光の放長制御方法

#### 2. 特許的求の頌囲

人

発振レーザ光の一部を、眩レーザ光の放長に対 応した位置に干渉葯を形成する光学手段に入射さ せ、前配干渉縞の位置が目額波長に関連した位置 と一致するように前記発掘レーザ光の彼長を変更 する手段を制御することを特徴とするレーザ光の 波長倒御方法。

## 3. 発明の詳細な説明

( 産费上の利用分野 )

本発明はレーザ光の波長制御方法に関する。

#### 〔従来の技術〕

従来、レーザ光の放長を知るためには、第5図 に示すようにレーザ光原1から出射したレーザ充 をレンズ・フィルタ等の前処母系2で加工し、分

光器3に適した光として分光器3の入射スリット 3 a に以入し、分光器 3 中の回折格子 4 b 、 3 c (あるいはプリズム)と回転ステージにより決め られた方向へ光を導き、出射スリット3dから光 が出てきた時を信号処理器4で検知し、このとき の回伝ステージの角度(回伝ステージの角度と液 長との関係は予め検定されている)からレーザ先 の彼長を検知する。

したがって、レーザ光の波長を所定の波長とな るように創御する場合には、予め所留の被長のレ ーザ光が入射するとき、出射スリット34から光 が出るように回伝ステージの角度を餌盛しておき、 レーザ光が前記出射スリット3dから出るように そのレーザ光の波長を放長選択手段(例えば調停 可能なエタロン)などによって同定する。

#### [発明が解決しようとする問題点]

しかし、分光器を用いて放長を同定する場合、 必ず環雄なアライメント作業が伴い、また良い分 析結果を得るためには大型の分光器が必要となり、 **装畳が大がかりかつ高価になる。** 

(2)

本発明は上配爽们に低みてなされたもので、分 光器を用いずにレーザ光の被長制御を行なうこと ができるレーザ光の被長制御方法を提供すること を目的とする。

(問図点を解決するための手段および作用)

本発明によれば、発振レーザ光の一部を、 
該レーザ光の波長に対応した位置に干渉標を形成する 光学手段に入射させ、この干渉編の位置が目標被 長に関連した位配と一致するように発振レーザ光 の波長を変更する手段を創御するようにしている。 【 
突旋例】

以下、本発明を忝付図面を参照して詳細に説明する。

第1図は、本発明の一実施例を示す級略図で、エキシマレーザ発振器10、エタロン11、ビームスプリッタ12、モニタエタロン系13、信号処理器14、制御器15、ガスプロセッサ16および調整装は17から結成されている。

エキシマレーザ発振器10は紫外域の液長を有するレーザ光を発振し、液長選択手段の1つである

(3)

ある。

第2図(a)より、 $\theta$ は  $\tan^{-1}$  ( $r_1/x$ )で得られるので、 $r_1$  の値(干渉紙の位配)を知ることができれば、上配第(1)式に基づいて破長  $\lambda$  を知ることができる。今、 $r_1=0.587$  m.  $r_2=1.827$  m.  $r_3=2.516$  m.  $R_4=3.054$  m.  $r_4=3.510$  mが得られたとすると、 $\nu$ 一ザ光の 放長は上式より  $\lambda=248.35$  nmが得られる。

なお、第2図中の13 a に球面レンズの代りにシリンドリカルレンズを使用しても良い。この場合得られる干渉点は(c)のような平行線のものである。(b)の同心円の干渉点と(c)の平行窓の干渉縞では(c)の方が縞に曲率のない分だけ高い、箱度で位置検出が可能である。

信号処理器14には予め目額波長が与えられており、信号処理器14は上記のようにして求めた皮長と目額放長とを比較し、発掘波長が目標放長と一致するように制御器15に制御信号を出力する。

創御器 15 は、信号処理器 14 から加えられる信号 に基づいてレーザ光の波長が目盤波長に一致する エタロン11は、入射する上配レーザ光のうち、特定の被長のレーザ光のみを過過させる。ビームスプリッタ12は入射するレーザ光を分割し、一方は主用途(例えば縮小投び似光装置)へ、他方はモニタエタロン系13に迎く。

モニタエタロン系13は第2図(a)に示すようにレンズ13a、エタロン13bおよびラインイメージセンサ13cから解成され、レンズ13aは入射したレーザ光を拡大し、エタロン13bを介してラインイメージセンサ13cの検出而上に入射させる。この検出而上には、第2図(b)に示すように干渉額が形成され、ラインイメージセンサ13cはこの干渉額の位置・間隔の僧報を信号処理器14に送る

信号処理器14は、まず上配入力収報からレーザ 充の波長を求める。すなわち、エクロン13 b は、 次式、

(4)

ようにガスプロセッサ16または胸壁装置17若しくはその両方に対して側側をかける。

すなわち、エキシマレーザ発振器10は、その発振性体であるガスの混合比に応じた放長のレーザ光を発振するが、上記ガスプロセッサ16は混合成分ガスの供給ラインに配置されたマスフローコントローラ・電磁弁等の開閉及びその時間間隔を創削してガス組成を変更し、これによってレーザ光の波長を目領液長に向って移動させる。

また、エタロン11はレーザ先の入射角の変化に でじて通過するレーザ光の放長を変化させること ができる。関発要領17は、例えばこのエタロン11 を回伝させるステップモータ等からなり、前配信 母処理器14から加えられる信号(パルス信号)に よりエタロン11の回伝角を制御し、これによって レーザ光の波長を目標波長に向って移動させる。 なお、エタロン11によって波長制御する場合、上 配回伝角制御に限らず、エタロン11のギャップ、 エタロン11のギャップ間のガス圧あるいはガスの 短額を変更するようにしてもよい。

(5)

なお、信号処理器14は必ずしも被長を束める必要はなく、予めモニタエクロン系13に目標被長のレーザ光が入射するときに形成される干海縞の位置を記憶しておき、検出した干海縞の位置が上記記憶した位質に形成されるように側御信号を出力するようにしてもよい。

また、上記実施例では、ビームスブリッタ12に よってレーザ光を分割し、モニタエタロン系13の レンズ13 a を介してレーザ光を拡大してエタロン 13 b に入射させるようにしたが、これに代えて光 ファイバを用いるようにしてもよい。すなわち、 光ファイバの一端を発振レーザ光束中に入れ、他 母猫をエタロン13 b の前方所定位置に対峙させる。

一方、モニタエタロン系13の代わりに、マイケルソン干渉計を用いてもよい。第3図に示すようにマイケルソン干渉計20は、2枚のレンズ21・22、2枚の全反射ミラー23・24およびピームスプリッタ25から額成されている。今、ミラー23・24が点0から等距値にある場合は、ビームスプリッタ25によって毎分されたレーザ光が等しい光路を過過

(7)

波長にピークを有する信号パターンを得るように してもよい。

第4 図は色泉レーザの液長制御を行なう装配の 突施例を示す。なお、第1 図と同一箇所には同じ 番号を付し、その詳細な脱明は省略する。

同図において、色泉レーザ31はエキシマレーザ、YAGレーザ等の励起レーザ30によって光ポンピングを行ないレーザ光を発掘する。そして、調整接近32は、制御器15からの相号によりそのレーザ光の発掘放長が目积放長となるように色楽レーザ31のステージを図励する。たお、色楽レーザ31の密媒の稻類あるいは最度を調盛して発展放長を制御するようにしてもよい。

なお、本鬼施例では、制御器15によってガスプロセッサ16や調整装置17を自動的に制御し、発掘液長を目積波長に一致させるようにしているが、オペレータが定期的にガスプロセッサ16や調整整置17を手動で網をして発振波長を目標波長に一致させるようにしてもよい。

(発明の効果)

した後、結像面名に到立するため、この結像面に は入射光の似がそのまま現れる。たお、レンズの 倍率によりサイズは変化することがある。

ここで、一方のミラー24を $\Delta$ hだけ後方に移動させると、ミラー24で反射された光は、 $2\Delta$ h cos  $\theta$  分だけ長い光路を預過した後、結似面26に到知するため、この増加分の光路長が放長 $\lambda$ に対して次式、

 $2\Delta h \cos \theta = m \lambda$  ----------- (2) を初足すれば、との $\theta$ の位位では光は強め合い、結役面26ではこの $\theta$  化函立する半径 f,  $\tan \theta$  の明るい円録を作る。

上配第(2)式からも明らかなように逆化 $\Delta$ hを特定の値(1mとか0.1m)に固定した場合、彼長 $\lambda$ の変化により $\theta$ 、つまり円程の半径が変化することになる。

したがって、結役面26にラインイメージセンサを配貸し、このラインイメージセンサにより明るい円限を検出するようにすれば、液長の変化をで 気的に検出したことになる。

(8)

以上説明したように本発明によれば、分光器を使用する必要がなくなるため装置が簡略になる。また、 放長検知部分の装置は従来の大型の分光器 に対して価格の面でも 1 桁ぐらい安価に解成できる。 さらに、 縮小投影回光用光源として本発明に係るレーザ光を用いると、 は光波長を所定の彼長に特度よく固定できるため、フォーカスエラーがなくなり歩留りがよくなる。

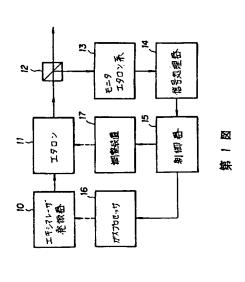
#### 4. 図面の簡単な説明

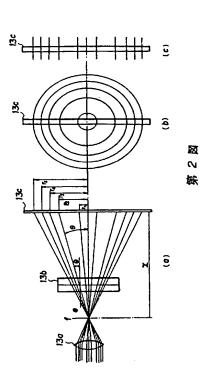
第1図は、本発明の一契施例を示す役略図、第2図(a)、(b)および(c)はそれぞれ第1図のモニタエタロン系を説明するために用いた図、第3図はマイケルソン干渉計を示す図、第4図は本発明による他の制御対象レーザを示す優略図、第5図は従来装置を示す段略図である。

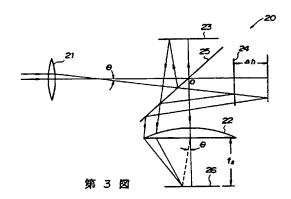
10…エキシマレーザ発掘器、11、13 b …エタロン、12…ビームスプリッタ、13…モニタエタロン系、13 a … レンズ、13 c … ラインイメージセンサ、14… 信号処理器、15 — 創御器、16…ガスプロセッ

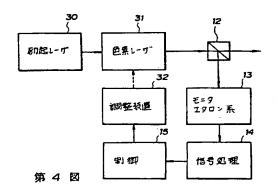
サポップ … 調整装置、20 … マイケルソン干渉計、30 … 励起レーザ、31 … 色素レーザ。

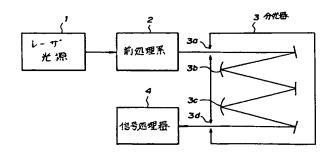
(11)











第 5 図

THIS PAGE BLANK (USPTO)